KTP晶体倍频器件的1.064µm和0.532µm双波长增透膜

刘训民 张爱荣

(山东大学晶体材料研究所, 济南)

摘要:本文介绍KTP (KTiOPO4) 倍频晶体端面等厚度三层倍频双波长增透膜的设计和制备工艺。该膜系结构和制备工艺简单,重复性好,在1.064µm和0.532µm的剩余反射率做到0.15%~0.20%。

AR coating of KTP frequency doubling devices for both 1.064µm and 0.532µm

Liu Xunmin, Zhang Airong

(Institute of Crystal Materials, Shandong University)

Abstract: A new design and preparation technique about the antireflective coating for SHG of KTP(KTiOPO₄) crystals are introduced. The coating is composed of three different films with identical thickness. The preparation is relatively easy, with high reproducibility. The residual reflectivity of both 1.064 μ m and 0.532 μ m has been reduced to as low as 0.15% ~0.20%

KTP 晶体是一种新型高效激光倍频材料,它的非线性系数大,光损伤阈值高,透光波 段宽,热导性好,失配梯度小,不潮解,机械性能和化学稳定性能好,能在较宽的温度范围 内实现 I、 I 类相匹配。该晶体用于Nd:YAG激光器上(基频光1.064μm)通过 KTP 晶体 器件获得1.064μm和0.532μm双波长输出。由于单波长"V"型增透膜增透带不够宽,只能 做到对1.064μm增透,而不能同时做到对0.532μm处的增透,这样由于绿光处表面反射的影 响,倍频效率比较低。如果在端面上镀制1.064μm和0.532μm的双波长增透膜,可使倍频效 率由40%提高到70%。并且使进一步做三倍频和四倍频成为可能。

由于KTP晶体的折射率比较高。在匹配方向通光时其折射率约为n=1.74。按照膜系设 计的要求,必须采用新的膜料才能做到双波长增透,为了尽可能地减小两个波长处的剩余反 射率和提高光学性能的重复性,我们着重对膜料的镀制工艺进行了研究,并获得了满意的结 果。在对大量镀制的KTP晶体器件的测量结果表明,工艺稳定,重复性好。在1.064μm 和 0.532μm两波长处的剩余反射率做到0.15%~0.20%,达到了激光倍频的使用要求。

一、膜系设计

对于一个多层膜系,在垂直入射时如果每一层的光学厚度nd满足下列两式;

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} nd \tag{1}$$

$$\pi - \delta = -\frac{2\pi}{\lambda'} - nd \tag{2}$$

分别将 δ 和 ($\pi - \delta$) 代入膜系的矩阵计算,其特征矩阵的矩阵元 M_{11} 、 M_{12} 、 M_{21} 、 M_{22} 的 绝对值对 λ 和 λ' 都将保持不变。因为某一波长处的反射率取决于在这一波长处的矩阵元的 绝 对值,所以这一膜系在 λ 和 λ' 处将有同样的反射率。如果使得在波长 λ 处增透,则在 λ' 处 也 增透。

将 (1) 式除以 (2) 式得:
$$\frac{\delta}{\pi-\delta} = \frac{\lambda'}{\lambda}$$
若取 \delta = \pi/3, 则: $\lambda = (\pi - \delta)\lambda'/\delta = 2\lambda'$ 可以看出λ和\lambda'为倍数关系, 若入为1.064µm, 则\lambda'为0.532µm。取 \delta = \pi/3, 由 (1) 式可得: $nd = \frac{\pi}{3} - \frac{\lambda}{2\pi} = 1773 Å$ 我们设计的三层双波长增透膜如图1所示,每层的光学厚度nd = 1773 Å, 即位相厚度 \delta = $\pi/3$ 。特征矩阵: $\begin{pmatrix} M_{11} & M_{12} \\ M_{21} & M_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\delta & \frac{i}{n_1}\sin\delta \\ in_1\sin\delta & \cos\delta \end{pmatrix}$ $\cos\delta & \frac{i}{n_2}\sin\delta \end{pmatrix}$ $\cos\delta = \frac{n_3}{n_1}\sin\delta \cos\delta$ $m_{11} = \cos^3 \delta - \frac{n_2}{n_1}\sin^2 \partial \cos\delta - \frac{n_3}{n_2}\sin^2 \delta \cos\delta - \frac{n_3}{n_1}\sin^2 \delta \cos\delta$ $M_{12} = \frac{1}{n_5}\sin\delta \cos\delta - \frac{n_2}{n_1n_5}\sin^2\delta + \frac{1}{n_2}\sin\delta \cos^2\delta + \frac{1}{n_1}\sin\delta \cos^2\delta$ $M_{12} = \frac{1}{n_5}\sin\delta \cos^2\delta + n_2\sin^2\delta \cos\delta - \frac{n_1n_3}{n_2}\sin^2\delta + n_1\sin\delta \cos^2\delta$ $M_{21} = n_1\sin^2\delta \cos\delta - \frac{n_2}{n_3}\sin^2\delta \cos\delta - \frac{n_1\sin^2\delta}{n_2}\sin^2\delta + n_1\sin\delta \cos^2\delta$ $M_{22} = -\frac{n_1}{n_5}in^2\delta \cos\delta - \frac{n_2}{n_3}in^2\delta \cos\delta - \frac{n_1\sin^2\delta}{n_2}\cos\delta + \cos^2\delta$ $n_2M_{12} = M_{21} = 0$ $m_3M_{12} - M_{21} = 0$ $m_3M_{12} - M_{21} = 0$ $m_1 = n_1 + n_2 + (\frac{n_1}{n_1} - \frac{n_1n_2}{n_2} - \frac{1-n_2}{12^2\delta}) n_3 - (n_1 + n_2)n_2 = 0$ $m_2M_{11} + \frac{n_1}{n_2} n_2^2 + (\frac{n_1}{n_1} - \frac{n_1n_2}{n_2} - \frac{1-n_2}{12^2\delta}) n_3 - (n_1 + n_2)n_2 = 0$



1。膜料选择

根据计算结果,我们采用了以下三种膜料:第一层SiO₂,第二层ZrO₂和 Al₂O₃ 的混合料,第三层Ta₂O₅。对于光学薄膜材料,除折射率要求之外,还有光学性能要求(如色散、吸收)和其它一些性能要求(如硬度,附着力,抗光伤,防潮,化学稳定性)等等。要选择 色散小的膜料,否则会造成在一个波长处剩余反射率较低而在另一个波长处偏高。就上述这 些性质而论,以上三种膜料,经过适当的工艺条件能够达到要求。

SiO₂是一种经常采用的膜料。我们采用的是熔石英棒,因为蒸发时的基体温度和蒸发 速率对SiO₂的折射率影响较小,所以蒸发工艺并不复杂。

ZrO2和Al2O3混合膜料。因为第二层膜料折射率的最佳值为1.75,没有一种单一膜料的 折射率值达到或近似达到这一要求,所以,我们选择了这种混合膜料,以求达到理论值。我 们用不同比例和不同蒸发条件在K。基板上做了单层实验,用比较测量法测量折射率,最后获 得了最佳配比和合适的蒸发条件。

实验表明Ta₂O₅膜料的折射率随蒸发条件变化很大。随着基体温度、真空度和蒸发速率 的不同,折射率可从1.95变化到2.3。我们恰恰利用这一性质,采取恰当的蒸发条件,满意地 获得了近似设计要求的材料折射率。

2.镀制

整个实验工作是在DMDE-450型镀膜机上进行的,用e型电子枪蒸发 高 熔 点 氧 化 物 SiO₂, ZrO₂ + Al₂O₃和Ta₂O₅,用反射法控制膜厚,用K₃做控制片。为了获得所需 要 的 真空度,开始时,应将真空度抽得足够高,然后按照每层材料所要求的真空度用针形阀对真 空室充入一定量的氧气。实验表明,这样做不但对获得理想的真空度行之有效,而且可提高 膜层的光学质量。另外,每层膜要求不同的基体温度和蒸发速率,这在蒸发时应特别注意, 否则也会造成剩余反射偏高。

高熔点氧化物材料蒸发时将大量放气,所以材料在镀前应彻底预熔,预熔后的材料再放入被镀件镀制,并且在挡板打开前还要稍加预熔。为了提高材料的纯度并减少污染,每次材料不宜放得太多,够一次用就可以了,这不但预熔彻底,而且便于控制真空度。

3.KTP器件的清洗处理

KTP晶体器件一般都比较小,为了使用方便,一般都把晶体镶嵌在玻璃框内。由于晶体 与外框之间是用胶粘在一起的,这就给清洗带来一定困难,不能用玻璃洗液浸泡。经过多次 实验,采取了以下清洗过程:

(1)晶体在光学加工时尽量保持表面及侧面清洁,并且加工后接着就镀,新鲜的光学表面可增加膜层的牢固度。

(2)用丙酮浸泡,但时间不要太长,时间太长会使胶软化,浸泡完成后,立即用干净纱 **布擦干净,浸泡的目的**是为了去掉玻璃外侧的污物。

(3)用绸布浇无水乙醇和乙醚混合液擦试,用10倍放大镜观察透光和反光,直至完全干 净为止。

(4)擦好的器件即放入钟罩镀制,以防污染。

4。热处理

众所周知, 热处理会使膜层更加致密、牢 固和稳定, 并能增加增透效果, 但KTP 器件 热处理时要注意两点: 第一, 温度不宜过高, 否则会使粘合剂软化或汽化, 导致影响膜层光 学质量, 第二, 时间要足够长, 这样才能消除 可逆现象。

三、实 验 结 果

研制的样品都是在 340 型分光光度计上测 量的。我们从1988年2月至1989年12月分别对多 批镀制的KTP倍频器件进行了测量,从统计结 果看出,工艺稳定,重复性好。测量结果见表1。

		样	0 00
1.064(µm)	0.532(µm)	个	数
0.33	0.42	5	
0.30	0.40	10	
0.24	0.32	50	
0.20	0.30	30	
0.15	0.20	5	

表1 50次镀制样品测量结果

光折变晶体四波混频在图象实时

加减及动态追迹显示中的应用

尚庆虎 于美文*

(电子科学研究院,北京)

摘要:本文提出了利用两个四波混频相位共轭反射镜的Michelson干涉仪系统 进行图象加、减、图象强度反转以及动态追迹显示的理论依据和实验方案,并获得 了理论分析与实验现象一致的结果,证明了这种方法的可行性。

Application of FWM photorefractive crystals in image real-time addition, subtraction and dynamic tracking display

Shang Qinghu, Yu-Meiwen*

(China Academy of Electronics and Information Technology)

Abstract: The theory analysis and experimental set-up of the optical image addition, subtraction, intensity inversion and dynamic tracking display are presented. The experimental set-up is a Michelson interferometer containing two four-wave-mixing phase conjugate mirrors. The experimental results are well accordant with the theory analysis.

*北京理工大学光学系。(Beijing Institute of Technology)。

通过选择高纯度的氧化物膜料,器件经过严格的清洗和干燥,适当改进镀制工艺和成膜 后一定温度下较长时间的热处理,可在KTP倍频器件上获得光学性能优越的双波长增透膜。

多考文献

- (1) 吴周令,范正修,唐晋发。光学薄膜吸收损耗的研究。光学学报,1989;
 9(8):741
- [2] 金林法,章宏芬,杨本祺。用于激光器的某些氧化物薄膜折射率的研究。 中国激光,1984;11(4):235

*

作者简介:刘训民,男,1958年10月出生。助工。现从事光学晶体(主要是激光晶体) 表面增透膜的研究。

张爱荣,女,1942年1月出生。实验师。现从事激光晶体增逢膜的研究。

收稿日期: 1990年5月25日。